INNOVATION

Mesures Solutions EXPO2022

- SOCIETE EXPOSANTE

Polytec France

- Logo

Polytec

- INNOVATION PRESENTEE

TopMap Micro.View® : une révolution dans la topographie de surface.

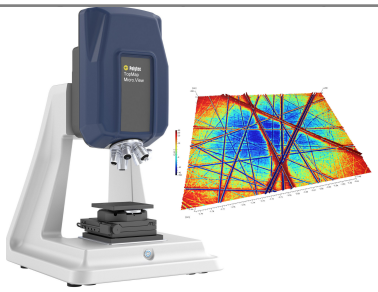
- DESCRIPTIF

Micro.View (+) est le système de métrologie optique nouvelle génération. Les innovations « Focus Finder » et « Focus Tracker » améliorent considérablement la facilité d'utilisation dans toutes les conditions : contrôle qualité en laboratoire et ligne de production. De plus, la technologie de balayage continu « CST » permet d'utiliser toute la plage de déplacement comme plage de mesure étendue soit jusqu'à 100mm. Détection des défauts et distorsions visuelles avec l'analyse d'imagerie couleur. Quantification de la topographie de surface avec une résolution inférieure au nanomètre et capture les détais de

- TYPE / EXEMPLE D'APPLICATION

Coating process quality : avant qu'une surface puisse être revêtue, elle peut nécessiter une préparation suivant sa fonction finale (gravure, martelage, polissage et rodage). En utilisant le TopMap Micro.View®, il est maintenant possible de mesurer de nombreux types de surface : très rugueux à super lisse avec des valeurs de rugosité RMS inférieures au nm. Cette technologie de mesure CST sans contact est

- ILLUSTRATION



- LIEN INTERNET

https://www.polytec.com/fr

- CONTACT

Rodrigo-Perez
Elodie
e.rodrigo-perez@polytec.fr